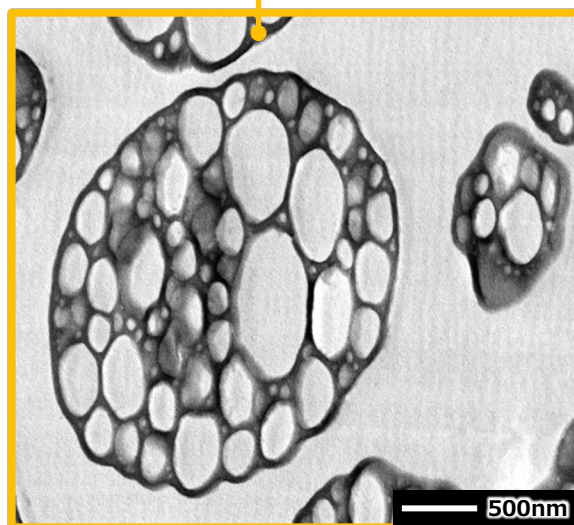
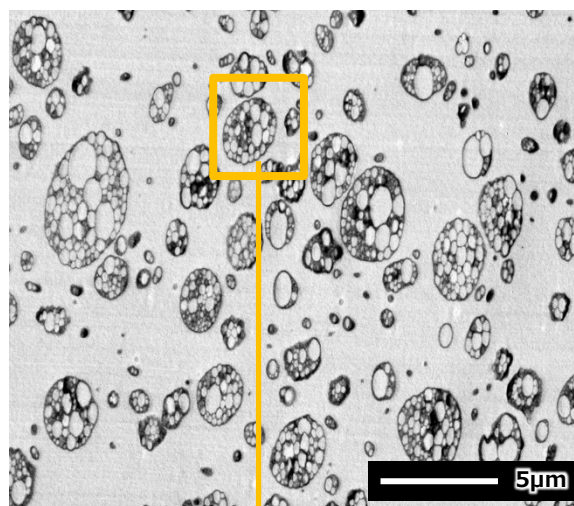


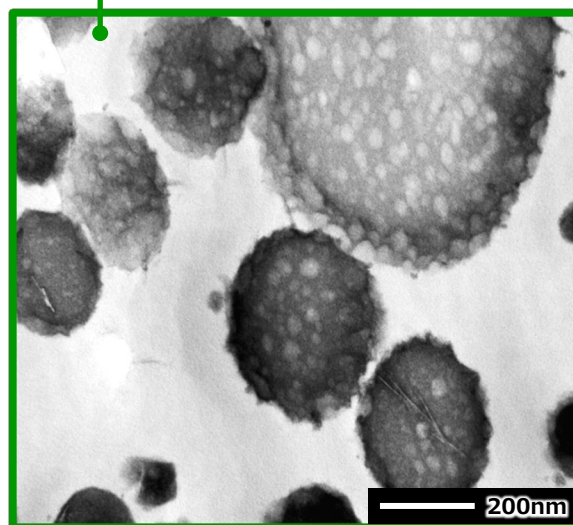
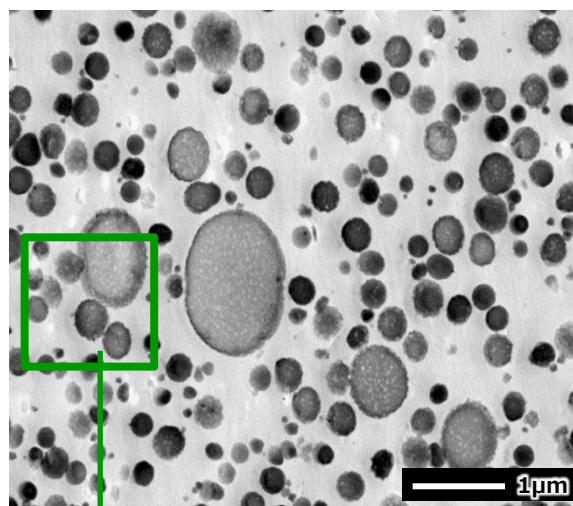
透過型電子顕微鏡(TEM)による スチレン系樹脂(HIPS,ABS)中の微小分散ゴムの観察

耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)とアクリロニトリロ・ブタジエン・スチレン(ABS)樹脂中の微小分散ゴムドメイン(ブタジエンゴム)のサラム構造を観察しました。両者のサラム構造の違いが明確に分かります。

【HIPS(ハインパクトポリスチレン)】



【ABS】



- ▼ 関連資料 ・ 透過型電子顕微鏡(TEM)画像の定量化(画像解析)
- ・ 透過型電子顕微鏡(TEM)によるブロックポリプロピレンの分散構造
 - ・ 透過型電子顕微鏡(TEM)による耐衝撃性樹脂材料観察事例

お問合せ先 株式会社ロンビック 樹脂検査分析センター

〒510-0871 三重県四日市市川尻町1000番地

TEL: 059-345-7622

E-mail: MCJP-DG-RBC_JUSHIBUNSEKI@mcgc.co.jp

FAX: 059-345-7174

URL: <http://www.rhombic.co.jp/>